



# 2M STRUMENTI



## CARATTERIZZAZIONE NANOMECCANICA QUANTITATIVA DELLE SUPERFICI TRAMITE MICROSCOPIA A SONDA IN SCANSIONE

*Dipartimento di Chimica*

*Università degli Studi di Bari*

*11 Marzo 2010*

### *Programma Scientifico*

#### **9,30 Registrazione**

#### **9.45 Benvenuto ed Introduzione**

Breve presentazione 2M Strumenti e Veeco Instruments. Verranno inoltre illustrati gli obiettivi ed il programma della giornata.

*(R. Mucciato, 2M Strumenti)*

#### **10.00 Presentazione Multimode 8 e ScanAsyst**

Presentazione del nuovo AFM Multimode 8 evoluzione del Multimode storico sistema di riferimento per imaging e spettroscopia di forza ad alta risoluzione. Il Multimode 8 è stato arricchito con la nuova tecnica ScanAsyst che rende automatica l'ottimizzazione della scansione permettendo risultati consistenti e di qualità in maniera facile e veloce

*(R. Mucciato e S. Pergolini, 2M Strumenti)*

#### **10.30 Caratterizzazione nanomeccanica quantitativa mediante Microscopia a Sonda in Scansione**

Verranno illustrati vari approcci alla caratterizzazione meccanica quantitativa alla nanoscala mediante la Microscopia a Sonda in Scansione. In particolare le tecniche HarmoniX™ e PeakForce QNM.

Una serie di esempi applicativi illustrerà le capacità di questi recenti sviluppi tecnologici, sviluppati da Veeco Metrology, di caratterizzare quantitativamente su scala nanometrica un ampio range di materiali, misurandone il modulo elastico, la viscosità, l'adesione ed altri parametri meccanici.

*(S. Pergolini, Application Scientist 2M Strumenti e S. Lesko, European Application Manager Veeco Metrology)*

#### **11.00 *Coffee Break***

#### **11.20 Dimostrazione pratica su AFM Veeco MultiMode 8 e PeakForce QNM**

*(S. Pergolini e S. Lesko)*

#### **12.30 Discussione e Conclusioni**